X 線自由電子レーザーが誘起するナノプラズマ誕生の 瞬間

熊谷嘉晃

東北大学 多元物質科学研究所 = 980-8577 宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1 (現所属:東京農工大学 = 184-8588 東京都小金井市中町 2-24-16)

福澤宏宣

東北大学 多元物質科学研究所 〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1

永谷清信

京都大学 〒608-8503 京都府京都市左京区北白川追分町

和田真一

広島大学 〒739-8526 広島県東広島市鏡山 1-3-1

上田 潔

東北大学 多元物質科学研究所 〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1

図旨 X線自由電子レーザー(XFEL)をライフサイエンスやマテリアルサイエンス等の分野へ幅広く利用する上で、XFELと物質の相互作用およびその相互作用が誘起する反応ダイナミクスの理解が必要不可欠である。本稿では、XFEL 誘起反応の代表である、XFEL パルス照射に由来したナノ結晶からのナノプラズマ生成に着目し、その生成メカニズムについて紹介する。XFEL と近赤外波長領域の光学レーザーを組み合わせたポンプープローブ法に基づいた時分割イオン分光計測により、XFEL 誘起ナノプラズマ誕生の瞬間を捉えた。そして、XFEL 誘起ナノプラズマ生成のごく初期段階における電荷再分配ならびにエネルギー移行に対して、二次電子と中性原子の非弾性散乱により生成する励起原子および励起原子間の原子間クーロン緩和が密接に関与していることが明らかにされた。

1. はじめに

X線自由電子レーザー(XFEL)は,照射時間わずか数十フェムト秒の短パルスかつ高強度の X線レーザーである。米国の XFEL 施設,LCLS¹⁾ に引き続き日本でも SACLA²⁾ が誕生し,世界中の研究者が XFEL 施設へ訪れ,タンパク質ナノ結晶の微細構造決定³⁾ や超高速光誘起過程の観測⁴⁾ を代表とした新分野を開拓している。さらに近年,韓国の PAL-XFEL⁵⁾,ドイツの EuXFEL⁶⁾,スイスの Swiss-FEL⁷⁾ といった新たな XFEL 施設が続々と稼働を開始した。また,2020年にはアップグレードした LCLS-II の利用が開始される予定である。今後,XFEL の超短パルス性と高強度性を利用した研究は,ライフサイエンスやマテリアルサイエンスをはじめとした多様な分野へとさらに広がりを見せると期待される。

XFELを多種多様な研究分野へ利用するためには、 XFELと物質の相互作用およびその相互作用が誘起する 反応過程®の理解が必要不可欠である。例えば、タンパク 質や遷移金属錯体のナノ結晶の結晶構造解析においては、 X線吸収により誘起される原子位置の変異や化学結合の 変化・切断ならびに電子密度の変化よりも速く XFEL パルスが試料を通過し、X線散乱することで、高い空間分解能が達成される。つまり、X線による結晶中の重原子の内殻光イオン化とそれに引き続き起こるオージェカスケードに起因したエネルギー移行および電荷再配分過程の解明、とくにその時間スケールが XFEL パルスを用いた結晶構造解析における空間分解能の向上等において重要である⁹⁾。

近年、XFELパルス照射によるナノ結晶内原子の内殻光イオン化と後続するオージェカスケードに起因し、ナノプラズマが生成することが明らかにされた100。XFELパルス照射に伴うナノプラズマ誘起反応はあらゆるナノ結晶において起こり得るXFEL誘起反応の代表であるため、そのダイナミクスの理解はXFEL利用研究において不可欠である。本稿では、SACLAにおいて実施した時分割イオン分光計測により捉えられたXFEL誘起ナノプラズマ誕生の瞬間、およびそれにより明らかにされたXFEL誘起ナノプラズマ生成におけるエネルギー移行および電荷再分配過程に対する中性励起原子の寄与について紹介する。

2. レーザー誘起ナノプラズマ

XFEL 誘起ナノプラズマの詳細について述べる前に, ナノ結晶に対して赤外波長(IR)や極紫外波長(XUV) 領域のレーザーをパルス照射した際に生じるナノプラズマ について触れておきたい¹¹⁻¹³⁾。IR や XUV レーザーのパ ルス照射によるナノプラズマ生成においては、ナノ結晶内 の各原子から価電子が光イオン化によって剥ぎ取られ,ナ ノ結晶の多重イオン化に伴いイオンコアが形成される。こ の多価イオンコアのクーロンポテンシャルに光電子が束縛 され、ナノメーターサイズの局所空間に擬自由電子とイオ ンコアが凝集したレーザー誘起ナノプラズマが形成される。

ここで、プラズマ内の電離を促進するメカニズムに着目 し、XFEL 誘起ナノプラズマとその他のレーザー誘起ナ ノプラズマを比較する。まず,IR レーザーでは,多光子 吸収やトンネルイオン化で生じた光電子の一部がイオンコ アに束縛される。さらに、これらの擬自由電子がレーザー 光の電場から運動エネルギーを受け取る逆制動放射 (Inverse bremsstrahlung; IBS) によって加速され,ナノ結 晶内の原子との衝突イオン化によりプラズマ内の電離が促 進される^{11,13)}。一方, XUV 波長よりも短波長の領域で は、レーザー電場の角振動数が大きいため、IBS の寄与は 小さい。XUV レーザー照射においては、逐次的な光イオ ン化に伴い高運動エネルギーの光電子が生成し、プラズマ 内の電離を促進する12,13)。

この様に IR, XUV レーザーおいては、光イオン化によ って直接的に生じた光電子がプラズマ生成における主な役 割を担う。これに対して、ナノ結晶に XFEL をパルス照 射した場合は、X線吸収により生じた光電子ではなく、 内殻光イオン化に続いてカスケード的に放出されるオージ ェ電子やそれらの電子と周囲の結晶内原子との衝突によっ て放出される低運動エネルギーの二次電子によりプラズマ 生成が進行する。従って、XFEL 誘起ナノプラズマ生成 は、間接的なナノプラズマ生成過程と言える¹⁰⁾。XFEL 誘起ナノプラズマのみならず、レーザープラズマ生成直後 においては、電子系と原子・イオン系はエネルギー的に非 平衡状態にある。つまり、直接的・間接的に依らず、如何 にして光から獲得したエネルギーを電子系が原子・イオン 系へ移行するか、そのエネルギー移行のチャンネルがレー ザープラズマ相互作用における問題となる。ここで、間接 的なナノプラズマ生成において注意したい点として, X 線を吸収した原子部位がオージェカスケードにより高価数 のイオンになるのに対して、オージェ電子との衝突により 外殻あるいは浅い内殻電子を放出したイオンはせいぜい1 価・2価までしか到達できないことである。つまり、オー ジェ電子・二次電子の生成直後は、プラズマ内イオンの電 荷分布に大きな勾配が存在する。この様な電荷勾配を緩和 する電荷再分配過程は電子系から原子・イオン系へのエネ ルギー移行過程に対して密接に関与する。すなわち,

XFEL 誘起ナノプラズマ生成のメカニズムを詳細に理解 するためには、如何にして電子系のエネルギーがプラズマ 内の原子・イオン系へ移行し、擬自由電子のエネルギーが 熱的平衡へ達するとともにプラズマ内の電荷がどのように 再分配されるかを明らかにする必要がある。

レーザーのパルス照射により生じたナノプラズマは, レーザーの波長に依らずクーロン爆発14)あるいは流体力 学的膨張15)を経て、最終的には多量の熱電子およびイオ ンフラグメントを放出し崩壊する。膨張中のナノプラズマ においては,ナノプラズマからの熱電子放出のみならず, ナノプラズマ内における電子-イオン再結合過程もその崩 壊過程に対して重要な役割を果たす12,13)。最近、時分割計 測法を用いた研究により、XUV レーザー誘起ナノプラズ マの膨張過程において、レーザーパルス照射後わずか数ピ コ秒 (ps) の間に電子-イオン再結合によって多量の励起 原子がナノプラズマ内に生成することが報告されてい

IR レーザーや XUV レーザーによるナノプラズマ生成 は、レーザーのパルス幅程度の時間スケールで起こること が容易に理解できる。それに対し、本稿で紹介する XFEL 誘起ナノプラズマ生成は、X線吸収による内殻光 イオン化に伴う二次電子の放出、つまりオージェカスケー ドと同程度の時間スケールで起こると推測される10)。上 で述べた様に、レーザープラズマの崩壊過程を捉えるため ならば, ピコ秒程度の時間分解能で十分であったが, XFEL 誘起ナノプラズマ誕生の瞬間を捉えるためには, フェムト秒(fs)の時間分解能を有する時分割計測が不可 欠であることはそれほど想像に難くない。

3. 時分割イオン分光計測

XFEL 誘起ナノプラズマ誕生の瞬間を捉えるために、 近赤外(NIR)領域のフェムト秒光学レーザーをプローブ 光として用いた時分割イオン分光計測を行った。XFEL 誘起ナノプラズマの生成には、SACLA から供給される光 子エネルギー5.5 keV の XFEL を用いた。Fig. 1に, SAC-

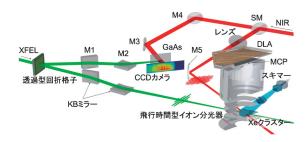


Fig. 1 (Color online) Schematic picture of the XFEL-pump-NIRprobe experiment. The position sensitive detector is constructed with microchannel plates (MCPs) and a delay-line anode (DLA). M1 and M2 are mirrors for XFEL beam, M3-M5 are mirrors for the NIR laser, and SM is a split mirror for the NIR laser. Reprinted from Ref. 19.

LA のビームライン3の実験ハッチ 4¹⁸⁾にて実施した実験 のセットアップを示す19)。超音速ジェット法により平均 クラスターサイズ5000アトムのキセノンクラスター (Xe₅₀₀₀) を生成し、Kirkpatrick-Baez (KB) ミラー²⁰⁾に よって集光された XFEL をパルス照射した。飛行時間型 イオン分光器²¹⁾によって、XFEL 誘起ナノプラズマから 放出されたイオンフラグメントの運動エネルギーおよび収 量を計測した。さらに、波長800 nm の NIR レーザーを XFEL 誘起ナノプラズマにパルス照射し、XFEL パルス に対する NIR レーザーパルスの到達時間差の関数として イオン収量を測定した。

先に述べた様に、XFEL 誘起ナノプラズマ誕生の瞬間 を捉えるためには、時分割イオン分光計測法の高時間分解 能化が鍵となる。しかし、SACLA においては XFEL パ ルスおよび NIR パルスの到達時間差には 1 ps (FWHM) 程度の時間揺らぎ19)が存在する。つまり、パルス幅<10 fsのXFEL および~30 fsのNIR レーザーを用いたとし ても, 二パルス間の大きな時間揺らぎに依存し, 時分割イ オン分光法の時間分解能は1ps程度まで悪化してしま う。そこで、本手法では、SACLA において整備された GaAs 薄膜結晶の透過光検出によるアライバルタイミング モニター²²⁾を用いて XFEL パルスおよび NIR パルス間の 到達時間差をショット毎に計測し、ポスト解析によって, その時間分解能を NIR レーザーのパルス幅程度の~50 fs まで大幅に向上することに成功した19)。

4. 時間分解能の評価法

Xe クラスターに対する時分割イオン分光計測の結果を 示す前に,孤立 Xe 原子に対する結果を示し,如何にして 本手法の時間分解能を評価したか説明する。また、孤立原 子系に対する XFEL パルス照射により誘起される現象 が、ナノ結晶と大きく異なる点も理解されたい。

孤立 Xe 原子への XFEL パルス照射によって、最高で 26価の多価イオンが生成する23)。また、イオンの価数分 布は Xe8+ にピークを持つ幅広いものになる。Xe原子に 対して、5.5 keV の X 線を照射すると、L 殻の電子が光電 子として放出されたのち、オージェカスケードにより電子 が次々と放出され、高価数のイオンが生成する。その価数 分布は、一光子吸収の場合、最大13価で8価にピークを 持つ²⁴⁾。つまり、XFELパルス照射による13価以上の高 価数イオン生成は、XFELパルス幅<10 fs の間に逐次的 な多光子吸収が起こり、内殻光イオン化およびオージェカ スケードが複数回繰り返されていることを意味してい 3^{23}

この様な XFEL パルス照射後の孤立 Xe 原子に対して, NIR レーザーを照射すると Xe 多価イオン (Xe¹¹⁺, Xe¹²⁺, Xe^{13+}) の収量増加が観測された。**Fig. 2(a)**に Xe^{13+} の収 量曲線を示す。横軸は、XFEL パルスに対する NIR パル

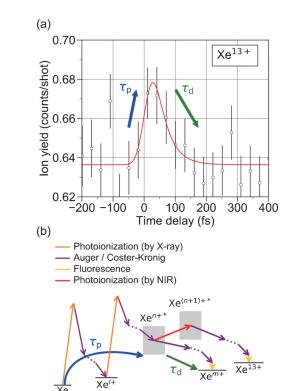


Fig. 2 (Color online) Ionization of Xe^{n+} states by the NIR laser in isolated atoms. (a) Xe13+ yield as a function of time delay of the NIR-probe pulse with respect to the XFEL-pump pulse. White circles and a red solid curve show the experimental results and the fitted result, respectively. (b) Schematic diagram for the ionization of the Xe^{n+} $(n \le m)$ states which decay into Xe^{m+} (m < 13) states without NIR probe. Reprinted from Ref. 19.

スの到達時間差である。この NIR レーザー照射による多 価イオンの収量増加は、オージェカスケードを伴う逐次的 多光子多重イオン化により生じた過渡的な励起状態 (Xe^{n+*}) が NIR レーザーによってイオン化されることで 起こる (**Fig. 2(b)**参照, $Xe^{n+*} + h\nu \rightarrow Xe^{(n+1)*} + e^{-}$)。

NIR パルスの遅延時間に対する Xe¹³⁺ イオンの収量増 加から、時分割イオン分光計測法の時間分解能を評価す る。内殻光イオン化したのち, Xe イオンはわずか10 fs 以 内 (τ_p) に過渡励起状態 Xe^{n+*} へと遷移し、数10 fs (τ_d) の内に後続のオージェ崩壊により失活する。そこで、時定 数 $\tau_{\rm p}$ および $\tau_{\rm d}$ を用いた指数関数を用いることで、 ${\rm Xe}^{n+*}$ への遷移過程の時間依存性は,

$$f(t) = \begin{cases} 0 \\ a \left[1 - exp\left(-\frac{t - t_0}{\tau_p}\right)\right] exp\left(-\frac{t - t_0}{\tau_d}\right) (t \ge t_0), \end{cases} \quad (1)$$

となる。ここで、たは遅延時間の原点である。(1)式の指 数関数f(t) を装置関数としてガウス関数g(t) によりコン ボリュートすることで、以下のフィット関数F(t)が得ら れる。

$$\begin{split} F(t) &= \left(f \bigstar g \right) \left(t \right) + C, \\ g\left(t \right) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp{\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2} \right)}. \end{split} \tag{2}$$

ここで、 σ はガウス関数の幅であり、Cは時間に依存しな い定数である。Fig. 2(a)の赤線は、時定数 τ_p を10 fs と仮 定し、(2)式を Xe^{13+} イオン収量曲線へフィットした結果 である。その結果、時間原点 t_0 は ± 20 fs の精度で得ら れ, ガウス関数の幅 σ は $\simeq 20\pm 20$ fs, 時定数 τ_d は $\simeq 40\pm$ $40 \, \mathrm{fs} \, \mathsf{と見積もられた}$ 。ガウス関数の幅 σ から時分割イオ ン分光計測法の時間分解能が~50 fs (FWHM) と評価さ れた。各フィット結果の信頼区間の大きさは主に実験デー タの統計量に由来している(Fig. 2(a)参照)。

5. XFEL 誘起ナノプラズマの電荷分布

Xe クラスターに対し XFEL をパルス照射した際は、1 価および2価イオン (Xe^+, Xe^{2+}) が主なイオンフラグメ ントとして観測された。高価数の多価イオンが観測されな いという事実は、オージェカスケードで生じた多価イオン が直ちに電荷をクラスター内の他の原子・イオンへ再分配 していることに他ならない。また、孤立 Xe 原子への XFEL 照射により生じた多価イオン Xe^{m+} (m=3-21) が ほぼ運動エネルギーを持たなかったのに対して、Xeクラ スターから放出された Xe+, Xe2+ は数10 eV 程度の平均 運動エネルギーを持っており、Xe+および Xe2+が XFEL 誘起ナノプラズマのクーロン爆発により生じたことは明ら

ここで興味深い結果として, XFEL のパルス照射に伴 い生じた Xe^+ および Xe^{2+} の運動エネルギー分布が、 XUV レーザー誘起ナノプラズマ²⁵⁾において観測されたも のとよく一致していた点が挙げられる。XUV レーザー誘 起ナノプラズマにおいて、ナノプラズマ膨張よりも迅速に 電荷再分配が進み、その結果として、イオンコア表面から 生成したイオンの運動エネルギーがイオンコアの径とナノ プラズマの総電荷(イオンコアのクーロンポテンシャルに 束縛されることなく放出された電子数)で与えられるのに 対して、内部から生じたイオンは0eVまで広がる幅広い 運動エネルギー分布を示すことが明らかにされた25)。 XFEL 誘起ナノプラズマにおいても,Xe+が数eVから 100 eV までの幅広い運動エネルギー分布を示しており、 Xe⁺ がイオンコア表面のみならず内部からも生成してい ることを示唆している。一方, Xe²⁺ の運動エネルギー分 布 (数 $10\,\mathrm{eV}\sim160\,\mathrm{eV}$) から、 $\mathrm{Xe^{2+}}$ がイオンコア表面か ら生じていることが示唆された。つまり、XUV レーザー 誘起ナノプラズマ^{12,13,25,26)}の場合と同じく, XFEL 誘起ナ ノプラズマにおいても電荷再分配がナノプラズマ膨張過程 よりもはるかに迅速に進行すると言える。

ここで、XFEL 誘起ナノプラズマの電荷 Q について考

える。Xe²⁺ がイオンコア表面から放出されるという事実 から、Qは静電気力に基づき Xe^{2+} の平均運動エネルギー、 $E_{\rm m}$ と以下の関係を持つ。

$$E_m = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2 q Q}{R} \,. \tag{3}$$

ここで、Rは Xe_{5000} の半径4.4 nm であり、 $E_{\rm m}$ = \sim 80 eV からQは \sim 120となる。また、総電荷Qは、総静電エネ ルギーが最小になる様に各イオンフラグメントへと分配さ れる 25)。そこで、n 個の Xe^{2+} がイオンコア表面にあり、 (Q-2n) 個の Xe^+ が一様に分布している場合、その総静 電エネルギー E'_2 は、

$$\begin{split} E_2' &= \frac{3}{5} \, \frac{(Q-2n)^2 e^2}{R} + (Q-2n) I_{01} \\ &+ n \, \left(\frac{2(Q-2n)^2 e^2}{R} + I_{01} + I_{12} \right) + \frac{1}{2} \, \frac{(2ne)^2}{R} \,, \end{split} \tag{4}$$

となる。ここで、 I_{01} と I_{12} は、それぞれ Xe 原子の第一、 第二イオン化ポテンシャルである。(4)式の第一項ならび に第二項は、それぞれ(Q-2n)個の Xe^+ の静電エネル ギーおよびイオン化エネルギー、第三項はn個の Xe^{2+} と (Q-2n) 個の Xe^+ 間の静電エネルギー、第四項と第五項 の和がn個の Xe^{2+} のイオン化エネルギー,第六項はn個 の Xe^{2+} の静電エネルギーである。(4)式より, $Q\sim120$ の 場合, E_2' が最小になるのは, Xe^+ および Xe^{2+} の比 (Q-2n)/n が ~ 2.5 の時であり、本研究で観測された Xe⁺ お よび Xe^{2+} の収量比 (\sim 3) ともよく一致していた。

ここで、光子エネルギー5.5 keV における Xe 原子の光 イオン化断面積は $\sim 0.166~{
m Mb}^{23)}$ であり、本測定における XFEL パルスのピークフルエンス $\sim 30 \,\mu\mathrm{J}/\mu\mathrm{m}^2$ から、各 Xe 原子の光イオン化確率は $\sim 57\%$ となる。Xe 原子のL殻光イオン化によって、数100 eV の運動エネルギーを持 つ光電子が~2800個放出される。これらの光電子の一部 はクラスター内原子との非弾性散乱によりエネルギーを損 失し、イオンコアに束縛されるが、多くはナノプラズマ外 へ放出されると予想される。また、Xe O L 殻光イオン化 によってカスケード的に平均8個のオージェ電子が放出 され、その約10%が1.5 keV 以上の運動エネルギーを持 つ²⁷⁾ためナノプラズマ外へと放出される。(Xe クラスター 内原子の密度および Xe 原子の電子衝突によるイオン化断 面積²⁸⁾から、1.5 keV 以上の運動エネルギーを持つ電子の 平均自由行程は Xe₅₀₀₀ の半径よりも長くなる。) 以上よ り、先に見積もられた総電荷 Q は光イオン化確率から予 想されるよりも一桁小さいことが分かる。この不一致の原 因は、XFELの Focal volume に対して、実験結果が平均 化され, 低強度 XFEL の寄与が大きくなっているためで ある12,26,29,30)。

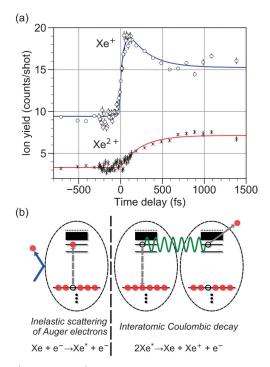


Fig. 3 (Color online) Ultrafast dynamics of XFEL-induced nanoplasma. (a) Xe⁺ and Xe²⁺ yields as a function of the time delay of the NIR-probe pulse with respect to the XFEL-pump pulse. The experimental Xe⁺ and Xe²⁺ yields are given by circles and crosses, respectively. The solid curves show results of the theoretical modeling of the process of NIR laser heating up of XFEL-induced nanoplasma. (b) Schematic diagrams for the inelastic scattering of Auger electrons and the ICD. Reprinted from Ref. 19.

6. XFEL 誘起ナノプラズマ生成の瞬間

Xe クラスターに対する時分割イオン分光計測の結果に 移る。まずは, Xe^{2+} の収量増加に着目する。Fig. 3(a) が 示す様に、Xe²⁺の収量は遅延時間に対して徐々に増加 し、 \sim 800 fs 付近で最大となる。この Xe^{2+} 収量の緩やか な増加は、NIR レーザーパルスによる XFEL 誘起ナノプ ラズマの表面プラズモン共鳴11,13)に由来する。ナノプラズ マ内の擬自由電子は IBS により、NIR レーザー電場から エネルギーを吸収することができ, 擬自由電子の加速に伴 いナノプラズマ内において電子衝突によるイオン化が促進 される。しかし、XFEL 誘起ナノプラズマが形成された 直後は、NIR レーザー電場が高密度の擬自由電子によっ て遮蔽されるため、レーザー加熱効率は著しく低下す る¹¹⁾。ナノプラズマ内の電子密度はプラズマ膨張^{29,31)}、お よび熱電子放出10), 電子-イオン再結合16,30,32)により, 時 間と共に徐々に減少していく。プラズマ内電子密度の減少 に伴い, NIR レーザーによるレーザー共鳴加熱の効率は 徐々に増加し,結果として XFEL 誘起ナノプラズマの崩 壊過程を反映する形で, Xe2+ 収量は遅延時間に対してゆ るやかに増加している。

次に, 遅延時間 0 fs 付近における突発的な Xe+ の収量

増加、および引き続き起こる緩やかな収量減少に着目する。この Xe^+ 収量の遅延時間依存性は、プラズマ膨張よりも遥かに高速な過程に由来している。すなわち、 Xe^+ 収量の遅延時間依存性こそが本研究で捉えたXFEL誘起ナノプラズマ誕生の瞬間を示している。

まず,突発的な Xe^+ 収量の増加について考える。これは,ナノプラズマ内に生成した高励起状態の中性原子 Xe^* の NIR レーザーによる光イオン化に由来している。では,如何にして XFEL パルス照射に伴い Xe^* が生成するのだろうか? Xe^* の生成過程として真っ先に挙げられるのが,XUV レーザー誘起プラズマにおいても観測された擬自由電子の三体再結合 $^{16,32)}$ である。しかし,三体再結合による Xe^* 生成はプラズマ膨張過程において起こるため,本研究で観測された Xe^* 生成ほど高速ではない。そこで,高速な Xe^* 生成過程として,オージェカスケードに伴い放出される電子とクラスター内原子との非弾性散乱による中性励起が想起される (Fig. 3(b) £)。

突発的な Xe^+ 収量の増加がプラズマ内における多量の Xe^* 生成に起因するのならば,後続する緩やかな収量減少はどの様な過程に由来するのか?それは, Xe^* 間における非輻射的なエネルギー交換,原子間クーロン緩和 (Interatomic Coulombic decay; ICD) 33 により説明できる。クラスター内に形成された二つの Xe^* 間において ICD が起こると,一つの Xe^* はイオン化し,もう一方の Xe^* は内部エネルギーを失い基底電子状態へ失活していく 33,34) (**Fig. 3(b)**)。本研究で用いた NIR レーザーの強度 (5×10^{13} W/cm²) では,ICD 後の基底電子状態の Xe 原子をイオン化するのは難しく,結果として, Xe^+ 収量が減少する。また,クラスター内部に多量の Xe^* が存在すると,カスケード的に ICD が起こると期待される 355 。

それでは、XFEL 誘起ナノプラズマ生成における、オージェ電子との非弾性散乱による Xe^* 生成および ICD による Xe^* 失活の時間スケールを明らかにすべく、 Xe^* および Xe^{2+} 収量の遅延時間依存性を連立反応速度式に基づいたモデルにより再現する。ここでは、異なる到達時間差において照射された二つのガウシアンレーザー、XFEL および NIR レーザーパルスによる Xe, Xe^* , Xe^* および Xe^{2+} の生成量の時間発展を連立反応速度式で求めた。そして、各遅延時間における計算結果が実験と一致する様にフィッティングを行なった。

XFEL パルスはある確率で Xe を Xe*へ励起,または Xe+ および Xe2+ へとイオン化する。これらの励起確率およびイオン化確率は,それぞれフリーパラメータである。次に,NIR レーザーパルスは Xe* を Xe+ へ光イオン化するだけでなく,レーザー共鳴加熱により Xe を Xe+ へ,Xe+ を Xe2+ ヘイオン化する。ただし,NIR レーザーから XFEL 誘起ナノプラズマのエネルギー吸収量はプラズマ膨張に依存するため,レーザー共鳴加熱によるイオン化確率は,必然的に XFEL パルスに対する XE1 NIR レーザーパ

ルスの遅延時間に依存する。そこで、以下の式(5)によっ て,ある遅延時間τ0におけるレーザー共鳴加熱に伴うイ オン化確率 κ の時間依存性を表す。

$$\kappa(t) = A\theta(t - \tau_0) \left[1 - \exp\left(-\frac{t - \tau_0}{\tau}\right) \right] \tag{5}$$

ここで、 $\theta(t-\tau_0)$ は Heaviside ステップ関数であり、A お よびτはフリーパラメータである。また、Xe*からXe+ への光イオン化確率もフリーパラメータである。最後に, ICD 過程は二つの Xe^* が遷移確率 κ_{ICD} によって、Xe お よび Xe⁺ へ遷移するとした。ただし、ICD により遷移す るものとそうでないもの、二種類のXe*がXFELパルス 照射により生成すると仮定した。以上より、本手法で用い た連立反応速度式には都合10個のフリーパラメータを含 めた。

本モデルにより、 Xe^+ および Xe^{2+} の遅延時間依存性を 再現した結果, Xe* はわずか~12 fs で生成することが示 された。孤立 Xe 原子において、オージェカスケードによ り過渡励起状態 Xe^{n+*} が10 fs の時間で生成することを思 い出すと, Xe クラスターにおける Xe* 生成もオージェカ スケードの間に起こることが理解できる。さらに Xe*間 における ICD の時定数は250 fs であった。ICD の時定数 は、励起状態、励起原子間距離および励起原子数に依存す るため、実験的に見積もるのは難しい。また、本手法によ り得られた ICD の時定数の信頼区間がやや大きかったた め、本稿では時定数のスケールについてのみ考える。実験 および理論計算34-36)により、希ガスクラスターにおける ICD の時定数が数100 fs であることが明らかにされてお り、本研究で得られた時定数(250 fs)もその範囲内であ った。

我々は、XFEL 照射直後の Xe クラスターに対して、さ らに NIR レーザーをパルス照射することで、Xe*の光イ オン化に伴う Xe+ 収量の突発的な増加を観測した。X線 吸収に伴う深い内殻光イオン化に引き続き起こるカスケー ド的な原子内・原子間緩和により二次電子が生成され,低 速二次電子の捕獲によりナノプラズマ形成される10)。 XFEL誘起ナノプラズマ誕生の瞬間における超高速な Xe* 生成は、これらの二次電子とクラスター内原子の非 弾性散乱に由来していた。わずか~10 fs の間にクラス ター内部で Xe* が多量に生成され、ICD (~250 fs) によ り失活していく現象が、XFEL 照射に伴うナノプラズマ 生成への入り口と言える。すなわち、我々は XFEL 誘起 ナノプラズマ誕生へ至る入り口を捉えたのである。

7. まとめと今後の展望

本稿では、時分割イオン分光法の高時間分解能化により 捉えられた XFEL 誘起ナノプラズマ誕生の瞬間について 述べてきた。我々は本手法によって、初めてナノ結晶中に

おける XFEL 誘起現象の詳細を捉えることに成功した。 これまで、XFEL 誘起ナノプラズマ生成において、荷電 粒子(電子およびイオン)が担うと考えられていたエネル ギー移行および電荷再分配に対して,中性励起原子の生成 失活もまた重要な役割を担っていることが明らかにされ た。また、本手法はあらゆる物質と XFEL パルスとの相 互作用によって誘起される電子および原子核のダイナミク スを理解する上で幅広く応用できる。

XFEL 誘起ナノプラズマの研究に関連した XFEL 利用 研究の将来展望に触れ、本稿の結びとする。XFEL を用 いたナノ結晶の構造決定における空間分解能は, XFEL 誘起ナノプラズマ生成, とくにその時間スケールと XFEL のパルス幅に強く依存する⁹⁾。そのため、XFEL 誘 起ナノプラズマ生成メカニズムの解明が試みられてきた。 しかし, Strongly-coupled many-particle 系である XFEL 誘起ナノプラズマの電子・原子核のダイナミクスを記述す るのは容易ではない。本研究で明らかにされた中性励起原 子のエネルギー移行および電荷再分配への寄与をはじめ, 今後の研究により更なる理解が望まれる。また、ナノ結晶 の構造決定のみならず、XFEL の超短パルス性と高強度 性を利用する限り、XFEL 誘起ナノプラズマ生成は決し て避けることが出来ない現象であることを改めて強調した い。筆者自身も XFEL を用いた様々な実験において、ナ ノプラズマ生成現象に助けられ,あるいは実験を妨害され てきた。世界中で推進されて行く XFEL 利用研究におい ても, XFEL 誘起ナノプラズマとの上手な付き合い方が 肝要となるであろう。

謝辞

本研究に対する京都大学の故八尾誠先生の多大なる貢献 に対し、深い感謝の意を表します。また、本研究は文部科 学省のX線自由電子レーザー利用推進研究課題およびX 線自由電子レーザー重点戦略研究課題,理化学研究所の SACLA 利用装置提案課題, JSPS 科研費, 多元研プロジ ェクト,人・環境と物質をつなぐイノベーション創出ダイ ナミック・アライアンス,および「物質・デバイス領域共 同研究拠点」における「人・環境と物質をつなぐイノベー ション創出ダイナミック・アライアンス」の共同研究プロ グラムの援助を受け行われました。最後に、本研究の遂行 に協力頂いた文献19)の共著者の方々、とくに理論計算を 提供して頂いた Heidelberg 大学の Nikolay Golubev 氏お よび Alexander Kuleff氏に感謝を申し上げます。

参考文献

- P. Emma, R. Akre, J. Arthur, R. Bionta, C. Bostedt et al.: Nat. Photonics 4, 641 (2010).
- T. Ishikawa, H. Aoyagi, T. Asaka, Y. Asano, N. Azumi et al.: Nat. Photonics 6, 540 (2012).
- H. N. Chapman, P. Fromme, A. Barty, T. A. White, R. A.

- Kirian et al.: Nature 470, 73 (2011); M. M. Seibert, T. Ekeberg, F. R. N. C. Maia, M. Svenda, J. Andreasson et al.: Nature 470, 78 (2011).; L. Redecke, K. Nass, D. P. DePonte, T. A. White, D. Rehders: Science 339, 227 (2013).
- R. Mankowsky, A. Subedi, M. Först, S. O. Mariager, M. Chollet et al.: Nature 516, 71 (2014); K. H. Kim, J. G. Kim, S. Nozawa, T. Sato, K. Y. Oang et al.: Nature 518, 385 (2015); P. Wernet, K. Kunnus, I. Josefsson, I. Rajkovic, W. Quevedo et al.: Nature 520, 78 (2015).
- I. S. Ko, H.-S. Kang, H. Heo, C. Kim, G. Kim et al.: Applied Sciences 7, 479 (2017).
- T. Tschentscher, C. Bressler, J. Grünert, A. Madsen, A. P. Mancuso, M. Meyer, A. Scherz, H. Sinn and U. Zastrau: Applied Sciences 7, 592 (2017).
- C. J. Milne, T. Schietinger, M. Aiba, A. Alarcon, J. Alex et al.: Applied Sciences 7, 720 (2017).
- 8) L. Young, E. P. Kanter, B. Krässig, Y. Li, A. M. March et al.: Nature 466, 56 (2010); S. M. Vinko, O. Ciricosta, B. I. Cho, K. Engelhorn, H.-K. Chung et al.: Nature 482, 59 (2012); H. Yoneda, Y. Inubushi, K. Nagamine, Y. Michine, H. Ohashi et al.: Nature 524, 446 (2015).
- H. M. Quiney and K. A. Nugent: Nat. Phys. 7, 142 (2011); B. Ziaja, H. N. Chapman, R. FaÃàustlin, S. Hau-Riege, Z. Jurek et al.: New J. Phys. 14, 115015 (2012).
- T. Tachibana, Z. Jurek, H. Fukuzawa, K. Motomura, K. Nagaya et al.: Sci. Rep. 5, 10977 (2015).
- T. Ditmire, T. Donnelly, A. M. Rubenchik, R. W. Falcone and M. D. Perry: Phys. Rev. A 53, 3379 (1996).
- U. Saalmann, C. Siedschlag and J. M. Rost: J. Phys. B 39, R39 (2006).
- T. Fennel, K.-H. Meiwes-Broer, J. Tiggesbäumker, P.-G. 13) Reinhard, P. M. Dinh and E. Suraud: Rev. Mod. Phys. 82, 1793 (2010).
- 14) I. Last and J. Jortner: Phys. Rev. A 62, 013201 (2000).
- M. Rusek and A. Orłowski: Phys. Rev. A 71, 043202 (2005); B. Ziaja, H. Wabnitz, E. Weckert and T. Möller: New J. Phys. 10, 043003 (2008).
- B. Schütte, M. Arbeiter, T. Fennel, M. J. J. Vrakking and A. Rouźee: Phys. Rev. Lett. 112, 073003 (2014).
- B. Schütte, F. Campi, M. Arbeiter, T. Fennel, M. J. J. Vrakking and A. Rouźee: Phys. Rev. Lett. 112, 253401 (2014); B. Schütte, T. Oelze, M. Krikunova, M. Arbeiter, T. Fennel et al.: New J. Phy. 17, 033043 (2015).
- M. Yabashi, H. Tanaka, T. Tanaka, H. Tomizawa, T. Togashi et al.: J. Phys. B 46, 164001 (2013).

- 19) Y. Kumagai, H. Fukuzawa, K. Motomura, D. Iablonskyi, K. Nagaya et al.: Phys. Rev. X 8, 031034 (2018).
- H. Yumoto, H. Mimura, T. Koyama, S. Matsuyama, K. Tono et al.: Nat. Photonics 7, 43 (2012).
- 21) H. Fukuzawa, K. Nagaya and K. Ueda: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 907, 116 (2018).
- 22) T. Katayama, S. Owada, T. Togashi, K. Ogawa, P. Karvinen et al.: Struct. Dyn. 3, 034301 (2016).
- H. Fukuzawa, S.-K. Son, K. Motomura, S. Mondal, K. Nagaya et al.: Phys. Rev. Lett. 110, 173005 (2013).
- T. A. Carlson, W. E. Hunt and M. O. Krause: Physical Review **151**, 41(1966).
- H. Iwayama, A. Sugishima, K. Nagaya, M. Yao, H. Fukuzawa et al.: J. Phys. B 43, 161001 (2010).
- M. Hoener, C. Bostedt, H. Thomas, L. Landt, E. Eremina et al.: J. Phys. B 41, 181001 (2008).
- A. G. Kochur, A. I. Dudenko, V. L. Sukhorukov and I. D. Petrov: J. Phys. B 27, 1709 (1994); A. G. Kochur and V. L. Sukhorukov: J. Phys B 29, 3587 (1996).
- D. Rapp and P. Englander-Golden: J. Chem. Phys. 43, 1464 (1965).
- 29) H. Thomas, C. Bostedt, M. Hoener, E. Eremina, H. Wabnitz et al.: J. Phys. B 42, 134018 (2009).
- T. Gorkhover, M. Adolph, D. Rupp, S. Schorb, S. W. Epp et al.: Phys. Rev. Lett. 108, 245005 (2012).
- S. Vikrant and Z. Beata: Phys. Plasmas 23, 012710 (2016).
- 32) H. Thomas, A. Helal, K. Hoffmann, N. Kandadai, J. Keto et al.: Phys. Rev. Lett. 108, 133401 (2012).
- 33) L. S. Cederbaum, J. Zobeley and F. Tarantelli: Phys. Rev. Lett. 79, 4778 (1997).
- A. I. Kuleff, K. Gokhberg, S. Kopelke and L. S. Cederbaum: Phys. Rev. Lett. 105, 043004 (2010); P. V. Demekhin, K. Gokhberg, G. Jabbari, S. Kopelke, A. I. Kuleff and L.S. Cederbaum: J. Phys. B 46, 021001 (2013); B. Schütte, M. Arbeiter, T. Fennel, G. Jabbari, A. I. Kuleff et al.: Nat. Commun. **6**, 8596 (2015).
- K. Nagaya, D. Iablonskyi, N. V. Golubev, K. Matsunami, H. Fukuzawa et al.: Nat. Commun. 7, 13477 (2016).
- D. Iablonskyi, K. Nagaya, H. Fukuzawa, K. Motomura, Y. Kumagai et al.: Phys. Rev. Lett. 117, 276806 (2016); T. Takanashi, N. V. Golubev, C. Callegari, H. Fukuzawa, K. Motomura et al.: Phys. Rev. Lett. 118, 033202 (2017).

著者紹介



熊谷嘉晃

東北大学多元物質科学研究所 助教 現所属:東京農工大学 助教 E-mail: kumagai@go.tuat.ac.jp 専門:放射線化学

[略歴]

2014年3月東京工業大学大学院理工学研 究科博士後期課程修了,博士(理学), 2012年4月日本学術振興会特別研究員, 2014年4月より東北大学多元物質科学研 究所産学官連携研究員(2016年4月から 助教),2017年4月よりアルゴンヌ国立研 究所(米国)博士研究員,2019年2月よ り現職。



福澤宏宣

東北大学多元物質科学研究所 助教 E-mail: fukuzawa@tohoku.ac.jp 専門:原子・分子・クラスター科学 [略歴]

2005年東京工業大学大学院理工学研究科 化学専攻博士後期課程修了,博士(理学), 首都大学東京大学院理学研究科リサーチ・ アシスタント, 東北大学多元物質科学研究 所教育研究支援者,同産学官連携研究員を 経て2009年より現職。



永谷清信

京都大学大学院理学研究科 助教 E-mail: nagaya@scpphys.kyoto-u.ac.jp 専門: 不規則系物理学

[略歴]

1985年京都大学大学院理工学研究科博士 後期課程単位取得退学、同年より京都大学 理学部教務職員,1998年より京都大学大 学院理学研究科助手,2003年博士(理学) 取得(京都大学),2007年より現職。



和田真一

広島大学大学院理学研究科 助教 E-mail: swada@sci.hiroshima-u.ac.jp 専門:光化学,分子分光学,簡単な分子系 での化学反応動力学

[略歴]

1997年東京工業大学大学院理工学研究科 化学専攻博士後期課程修了,博士(理学), 通産省産業技術融合領域研究所博士研究員 を経て、1998年広島大学理学部助手、 2010-2011年米 SLAC 国立加速器研究所客 員研究員、2007より現職。



上田 潔

東北大学多元物質科学研究所 教授 E-mail: kiyoshi.ueda@tohoku.ac.jp 専門:原子分子科学,電子分子動力学 [略歴]

1982年3月京都大学大学院工学研究科博 士後期課程修了,工学博士,同年4月より 東北大学科学計測研究所助手, 1985-1987 年米国メリーランド大学客員研究員, 1990年6月より東北大学科学計測研究所 助教授, 1992-1993年英国ダーズベリー研 究所招聘研究員、1996-1997年仏国パリ南 大学客員教授,2003年4月より現職。

The birth of a nanoplasma produced by an ultrashort hard-x-ray laser in xenon clusters

Yoshiaki KUMAGAI Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku

University, Sendai 980-8577, Japan

(Present: Department of Applied Physics, Tokyo University of Agriculture

and Technology, Tokyo 184-8588, Japan)

Hironobu FUKUZAWA Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku

University, Sendai 980-8577, Japan

Kiyonobu NAGAYA Graduate School of Science, Kyoto University, Kyoto 606-8502, Japan

Graduate School of Science, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima, 739-

8526, Japan

Kivoshi UEDA Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku

University, Sendai 980-8577, Japan

Shin-ichi WADA

Abstract We have revealed a surprisingly ultrafast population (\sim 12 fs), followed by a slower depopulation $(\sim 250 \text{ fs})$ of highly excited states of atomic fragments generated in the process of XFEL-induced nanoplasma formation. Inelastic scattering of Auger electrons and interatomic Coulombic decay are suggested as the mechanisms populating and depopulating, respectively, these excited states. The observed response occurs within the typical x-ray pulse durations and affects x-ray scattering, thus providing key information on the foundations of x-ray imaging with XFELs.